AOFAT

Advanced Oxides For Advanced Technologies

Óxidos avanzados II-VI para la electrónica, sensado y tecnologías fotónicas

PROMETEO 2011/035



Jornada científica sobre obtención y caracterización de materiales avanzados

Valencia, 18-19 de Noviembre de 2014 Departamento de Física Aplicada (Universidad de Valencia)

PATROCINADOR

PRESENTACIÓN

PROGRAMA



Consellería de Educación

Coordinación

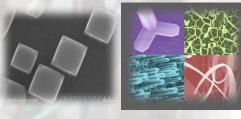
Vicente Muñoz Sanjosé

Comité organizador

Carmen Martínez Tomás Antonia Atencia Henarejos









El grupo de crecimiento cristalino y caracterización de semiconductores (CreCYCSem) está constituido por investigadores del departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo de la Universidad de Valencia, del Instituto Jaume Almera (CSIC) de Barcelona y del departamento de Física Aplicada II y Electricidad y Electrónica de la Universidad del País Vasco.

La actividad investigadora del grupo se centra en:

- □ Crecimiento cristalino de materiales avanzados, tanto en volumen, como en forma de capas y nanoestructuras, mediante diferentes técnicas (MOCVD, SP, PVT, THM, Bridgman...)
- □ Caracterización morfológica y estructural (SEM, HRTEM, HRXRD...)
- □ Caracterización de propiedades físicas, en particular de propiedades ópticas y defectos.

OBJETIVOS de la Jornada

- □ Difusión de las actividades del grupo.
- □ Consolidación y fomento de colaboraciones científicas.
- Discusión del "estado del arte" en lo referente a los métodos y técnicas de obtención y caracterización avanzados.

18 Noviembre 2014

Mañana

10:30 Saludo de bienvenida.

Prof. Vicente Muñoz Sanjosé.

Inicio de la Jornada Académica.

- 10:45 Estado del arte: Principales contribuciones en los últimos tres años.
- 11:15 "Optical analysis of ZnMgO grown by spray pyrolysis and the application to UV photodetection"
 - D. Manuel López Ponce

11:45 Pausa y café

12:15 "ZnTe/ZnO junctions"

Na. Ade Huerta i Barberà

12:45 "ZnO/ZnMgO light polarization sensitive photodetectors"

Dr. Adrián Hierro Cano

13:15 "Substructural characterization and defects density determination by the modified Williamson-Hall method"

Dra. Carmen Martínez Tomás

13:45 Comida

15:00 "Characterization of structural defects in nanostructured materials by TEM."

Dr. Saïd Agouram

15:30 "ZnMgO nano-structures grown by MOCVD: first steps"

D. Lluís M. Guia Martín

16:00 "Growth and Characterization of Zn_{1-x}Mg_xO thin films."

D. Vicente Marín Borrás

16.30 ""Structual and substructual investigation of Zn_{1-v}Mn_vTe policrystalline films""

D. Oleksii klimov